

**REGLAMENTO (CE) Nº 882/94 DE LA COMISIÓN**  
de 20 de abril de 1994

por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

*Artículo 1*

Visto el Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común <sup>(1)</sup>, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 779/94 de la Comisión <sup>(2)</sup>, y, en particular, su artículo 9,

Considerando que los artículos 291 a 304 del Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión <sup>(3)</sup>, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 655/94 <sup>(4)</sup>, <sup>(5)</sup>, determina las condiciones de admisión de determinadas mercancías a los beneficios de un régimen arancelario de importación favorable, en razón de su destino especial ;

Considerando que determinados tipos de equipo de prueba de circuitos integrados en virtud del Reglamento (CE) nº 3080/93 del Consejo <sup>(6)</sup> gozan de exención de derechos de aduana a la importación en virtud de las disposiciones de destino especial cuando se utilicen para la prueba de funcionalidad de circuitos integrados ;

Considerando que es posible que haya dificultades a la hora de distinguir entre los cuatro tipos diferentes de equipo de prueba de circuitos integrados para la prueba de funcionalidad de circuitos integrados que gozan de exención de derechos de aduana a la importación en razón de su destino especial y mercancías similares, teniendo en cuenta que ambos tipos se clasifican en el código NC 9030 81 ; que es posible hacer esta distinción utilizando denominaciones específicas ; que en el capítulo 90 de la nomenclatura combinada se deberán introducir notas adicionales a tal efecto ; que el Reglamento (CEE) nº 2658/87 deberá modificarse en consecuencia ;

Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen de la sección de la nomenclatura arancelaria y estadística del Comité del código aduanero,

<sup>(1)</sup> DO nº L 256 de 7. 9. 1987, p. 1.

<sup>(2)</sup> DO nº L 91 de 8. 4. 1994, p. 12.

<sup>(3)</sup> DO nº L 253 de 11. 10. 1993, p. 1.

<sup>(4)</sup> DO nº L 82 de 25. 3. 1994, p. 15.

<sup>(5)</sup> DO nº L 277 de 10. 11. 1993, p. 1.

Las notas adicionales siguientes se añadirán al capítulo 90 de la nomenclatura combinada adjunta al Reglamento (CEE) nº 2658/87 :

2. A efectos de la subpartida 9030 81 20, por la expresión "aparatos de prueba para la producción de semiconductores de conexión lateral", se entenderá el aparato electrónico para probar la funcionalidad de los circuitos integrados (en fase de fabricación) que se monten en cuadros de prueba que utilicen conexión lateral, que consten de una cabeza de interfaz para la conexión con los componentes objeto de la prueba, generadores de señales, una unidad de control de la señal, unidad(es) de medida y comparación y la correspondiente alimentación energética.
3. A efectos de la subpartida 9030 81 81, por la expresión "aparatos de prueba para la producción de semiconductores" se entenderá el aparato electrónico para probar la funcionalidad de circuitos integrados digitales (en fase de fabricación), con funciones de temporización programable, formato de los datos de las señales y de la velocidad de prueba, sin interrupción del ciclo de prueba, que consten de una cabeza de interfaz para la conexión con los componentes objeto de la prueba, unidad(es) de medida y comparación digital(es) y la correspondiente alimentación energética.
4. A efectos de la subpartida 9030 81 83, por la expresión "aparatos de prueba para la producción de semiconductores" se entenderá el aparato electrónico para probar la funcionalidad de circuitos mixtos analógicos y digitales (en fase de fabricación), que consten de una cabeza de interfaz para la conexión con los componentes objeto de la prueba, una unidad de control de las señales, generadores de señales analógicas y digitales, unidad(es) de medida y comparación analógica(s) y digital(es) y la correspondiente alimentación energética.
5. A efectos de la subpartida 9030 81 85, por la expresión "aparatos de prueba para la producción de semiconductores" se entenderá el aparato elec-

trónico para probar la funcionalidad de circuitos análogos (en fase de fabricación), que consten de una cabeza de interfaz para la conexión con los componentes objeto de la prueba, una unidad de control de las señales, generadores de señales análogas, unidad(es) de medida y comparación análoga(s) y la correspondiente alimentación energética.»

*Artículo 2*

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

Será aplicable a partir del 1 de diciembre de 1993.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 20 de abril de 1994.

*Por la Comisión*

Christiane SCRIVENER

*Miembro de la Comisión*

---